Material Characterization

Metrology

Foreign Materials 異　物

微小部X線分析装置

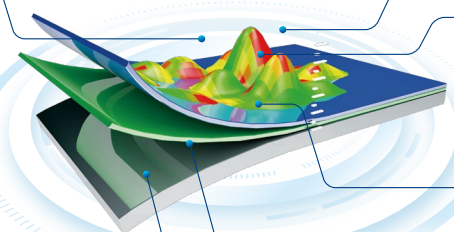
XGT-9000 Expert

- B(ホウ素)からの軽元素分析対応
- 透過X線による部品内部観察可能
- 金属薄膜の膜厚分析

New

[分析技術]

- 分光エリプソメトリー
- ラマン分光
- フォトルミネッセンス
- カソードルミネッセンス
- グロー放電発光
- 蛍光X線

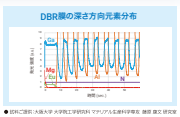


Depth Profile 深さ方向元素分布

マーカス型高周波グロー放電発光表面分析装置

GD-Profiler2

- 迅速深さ方向元素分析　● H(水素)～U(ウラン)まで対応
- 超高真空不要



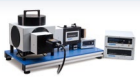
● 材料工学科 大島大学 大学院工学研究科 マテリアル生産科学専攻 講師 博士 研究室

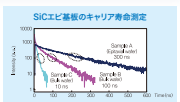
Career Lifetime キャリア寿命

PL寿命測定装置

DeltaFlex

- PL寿命測定によりキャリア寿命を評価
- 多彩な光源波長レパートリー　● ピコ秒から数秒のワイドレンジのPL寿命に



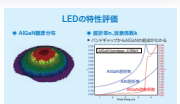


Film Thickness / Bandgap 膜厚・膜質　バンドギャップ

分光エリプソメーター

UVISEL Plus

- 超薄膜の膜厚・屈折率・消衰係数を分析
- チャンバーに装着可能



Defects / Impurities 結晶欠陥・不純物

フォトルミネッセンス測定システム

SMS

- お手持ちの顕微鏡を分光システムに！
- ラマン、PL、PL寿命測定が可能
- マッピング測定対応可能

カソードルミネッセンス測定システム

HORIBA CLUE Series

- SEMのポートに挿入
- ラマン分析とカップリング可能
- 広域測定への改造可能

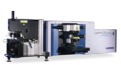
Stress 応　力

顕微ラマン分光測定装置

LabRAM HR Evolution

- 業界最高レベルの応力分解能
- 12インチウェハまでマッピング測定対応可能
- クライオスタット使用可能

AFMラマン統合装置

LabRAM HR Evolution Nano

- AFMとラマンを1台で
- nmオーダーの空間分解能
- 試料の移動が不要